

(3) **Japanese Patent Application Laid-Open No. 57-162340 (1982)**

**“METHOD OF ANNEALING SILICON SEMICONDUCTOR”**

The following is English translation of an extract from the above-identified document relevant to the present application.

5       The invention disclosed in this publication is directed to an annealing apparatus by flash irradiation, which includes a sample stage 5 capable of being preheated by means of a heater, for example.

⑬ 日本国特許庁 (JP)

⑭ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭57—162340

⑪ Int. Cl.<sup>3</sup>  
H 01 L 21/324

識別記号

庁内整理番号  
6851—5F

⑬ 公開 昭和57年(1982)10月6日

発明の数 1  
審査請求 未請求

(全 8 頁)

⑭ シリコン半導体のアニール方法

① 特 願 昭56—46256

② 出 願 昭56(1981)3月31日

⑦ 発 明 者 荒井徹治  
姫路市別所町佐土字春日1194番  
地ウシオ電機株式会社播磨工場  
内

⑦ 発 明 者 五十嵐龍志  
姫路市別所町佐土字春日1194番  
地ウシオ電機株式会社播磨工場  
内

⑦ 出 願 人 ウシオ電機株式会社  
東京都千代田区大手町2丁目6  
番1号朝日東海ビル19階

明 細 書

1. 発明の名称 シリコン半導体のアニール方法  
2. 特許請求の範囲

あらかじめ温度  $T_A$  (°C) に予備加熱されたシリコン半導体と、閃光放電灯からの閃光照射でアニールするにあたって、シリコン半導体の反射率  $\bar{R}$ 、閃光のパルス巾 ( $\frac{1}{2}$  波高長) を  $\tau$  (マイクロ秒)、シリコン半導体上における照射強度を  $E$  (ジュール/cm<sup>2</sup>) とした時、 $\tau$  が、70 以上 780 の範囲であつて

$$2.3 \times 10^{-3} \leq \tau \leq \frac{(1-\bar{R})E}{1410-T_A} \leq 3.8 \times 10^{-3} \text{ 秒}$$

なる関係が維持される条件でアニールすることとを特徴とするシリコン半導体のアニール方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、シリコン半導体のアニール方法に関する。

シリコン半導体は基板として、種々の IC、LSI 等と製作する場合、不純物イオンとしてリン(P)、ホウ素(B)、硼素(B<sub>10</sub>) 等と高エ

ネルギーでイオン打ち込みすることが行われる。この場合、良く知られているように、シリコン半導体に結晶損傷が生ずるので、このイオン打ち込み工程後、必ず結晶損傷回復のためのアニール工程が必要とする。

従来、このアニール工程では、電気炉法とレーザービーム法とが知られているが、いづれも実用上問題が多く、ごく最近では、閃光放電灯による閃光照射と利用することが検討されている。

閃光放電灯は周知の如く、一般には、ガラス製、特殊なものでは透光性セラミック製の封体バルブを有し、閃光照射の強度を大きくすると閃光放電灯の使用寿命が著しく短くなる欠点があるとともに、シリコン半導体の表面は平滑度も高くするために鏡面加工されているので、シリコン半導体上における照射強度を定めるだけで、必ずしも良好なアニールは実行できない。例えば、ドーピング効率 40% 以上のアニールに閃光放電灯の照射のみで実行しようとするとは案外にはかなりの困難ともなる。

上記理由から、マニール法での昇温エネルギーと全波長光放電灯からの間光照射によることを避け、あらかじめある温度まで予備加熱しておいて比較的間光照射の強度が小さく済むよう甘予備加熱方式(サーマルマシスト法)と併用し、更に、シリコン半導体の反射率も考慮しなう元で間光照射の強度と定めた方がよい。

ところで、反射率 $\tilde{R}$ を有するシリコン半導体に、パルス巾(1/2波高長)を $t$ (マイクロ秒)の間光でシリコン半導体上における照射強度 $E$ (ジュール/cm<sup>2</sup>)と与えたと、シリコン半導体の表面の上昇温度は、パルス巾がおよそ50マイクロ秒以上では、近似的に次式で与えられる。

$$T(^{\circ}\text{C}) = \alpha \cdot (1 - \tilde{R}) \cdot E \cdot t^b \dots \dots \dots (1)$$

式(1)において、 $\alpha$ はその物質の特定の温度における、熱伝導率、密度、比熱等で定まる定数、 $(1 - \tilde{R}) \cdot E$ は、その物質に吸収された単位面積当りのエネルギーである。したがって、マニール温度の上限値と $T_H$ 、予備加熱された温度と $T_A$ とすると、間光照射によって昇温してやればよい温度差は、

$$2.3 \times 10^{-3} t^{0.27} \leq \frac{(1 - \tilde{R}) \cdot E}{1410 - T_A} \leq 3.8 \times 10^{-3} t^{0.28}$$

はる関係が維持される条件でマニールすることにある。

以下図面を参照しながら本発明の実施例を説明する。

第1図は本発明に使用する間光放電灯の説明図であって、1は一对の電極2は封体バルブであって、アーク長 $L$ は40mm、バルブ内径 $D$ は8mm、外径は10mmの寸法を有する直管状のものとする。この間光放電灯を、第2図に示すように、平面 $S_1$ 内に5本、平面 $S_2$ 内に4本、合計9本が平行状に並列して配置され、この9本の間光放電灯群によって、約50mm×40mmの間光面光源の形成されるように配置する。そして、平面ミウ-4と、平面 $S_2$ に近接した平面 $S_3$ 内に配置し、ヒーター等で予備加熱できるようにした試料台と、光源から約10mm(=H)離間して配置し、全体をマニールとして構成する。

第2図のマニール炉において、シリコン半導

$$T_H - T_A = \alpha \cdot (1 - \tilde{R}) \cdot E \cdot t^b \dots \dots \dots (2)$$

の式で与えてよい。そして更に、式(2)を変形して $\alpha$ を $\alpha'$ 、 $b$ を $b'$ と置き替えると、

$$(1 - \tilde{R}) \cdot E = (T_H - T_A) \cdot \alpha' \cdot t^{b'} \dots \dots \dots (3)$$

もしくは

$$\frac{(1 - \tilde{R}) \cdot E}{T_H - T_A} = \alpha' \cdot t^{b'} \dots \dots \dots (4)$$

としてよい。

本発明に係る観点から、予備加熱温度、反射率、パルス巾、照射エネルギー等の要因を考慮しなうことで、ドーピング効率が45%以上で、良好なシリコン半導体のマニール法を提供することを目指すとしておされたいものである。その特徴とするところは、あらかじめ温度 $T_A(^{\circ}\text{C})$ に予備加熱されたシリコン半導体と間光放電灯からの間光照射でマニールすることによって、シリコン半導体の反射率 $\tilde{R}$ 、間光のパルス巾(1/2波高長)を $t$ (マイクロ秒)、シリコン半導体上における照射強度 $E$ (ジュール/cm<sup>2</sup>)とした時、 $t$ が70≦ $t$ ≦780の範囲であって、

焼のウェハー6は、試料台上に配置されるとに、ウェハー上における照射強度 $E$ (ジュール/cm<sup>2</sup>)及びパルス巾 $t$ (マイクロ秒)は、間光放電灯に供給される電流入り及び電気回路条件と変えることにより、また、予備加熱温度 $T_A(^{\circ}\text{C})$ はヒーターの温度と変えることにより、種々の値を選択でき、マニール実験に供したウェハーは、結晶粒長の深さが大体0.2μm~1.0μm、ウェハーの厚みは、300μm~650μmのものとする。

第3図は予備加熱温度 $T_A$ 、照射エネルギー $E$ 、パルス巾 $t$ を変えて測定した多数の実験結果を、 $X$ 軸と $Y$ 軸とに、 $Y$ 軸は $\frac{(1 - \tilde{R}) \cdot E}{T_H - T_A}$ として整理したものである。X軸はマニール不足または不良、O印はマニール良好を示し、 $t$ が70~780の範囲内で、直線 $X_1$ と $X_2$ との間の区域が、良好なマニールが出来ることを示している。そして、このデータの数値に $\alpha'$ と $b'$ がよく適合するように式(5)の定数 $T_H$ および $\alpha'$ 、 $b'$ を求め、 $T_H = 1410(^{\circ}\text{C})$ 、 $X_1$ における $\alpha' = 2.3 \times 10^{-3}$ 、 $b' = 0.27$ 、 $X_2$ における

$\alpha' = 3.8 \times 10^{-3}$ ,  $b' = 0.28$  を決定した。又、反射率  $\bar{R}$  は、次式(5)で定義している。

$$\bar{R} = \frac{\int R(\lambda) \cdot I(\lambda) d\lambda}{\int I(\lambda) d\lambda} \quad (5)$$

こゝにおいて、 $\lambda$  は波長、 $R(\lambda)$  は  $\lambda$  にあつる反射率、 $I(\lambda)$  は  $\lambda$  にあつる閃光の強度である。

以下、個々のアニール実験の代表的例を説明する。

(1) ヒジを加速エネルギー 50 keV で、 $5 \times 10^{15}$  個/cm<sup>2</sup> 打ち込んじ、反射率  $\bar{R}$  が 0.45 のウエハーを 550°C に予備加熱しておき、このウエハーを、 $t = 50$ 、 $E = 15.6$  の閃光で照射した場合、ドープング効率が 40% とはり、アニール不足が生ずる。同様に、 $t$  が 50 以下、その他の予備加熱の温度、与える  $E$  に変化に要してもドープング効率が更に下がり、アニール不足が見られる。

(2) リンを加速エネルギー 50 keV で、 $2 \times 10^{15}$  個/cm<sup>2</sup> 打ち込んじ、反射率  $\bar{R}$  が 0.46 のウエハーを 350°C に予備加熱しておき、このウエハーを、 $t = 70$ 、 $E = 20.0$  の閃光で照射した場合、ドープ

ング効率は 90% である(アニール良好)。

(3) 上記(2)と同じウエハーを、予備加熱 500°C、 $t = 70$ 、 $E = 12.2$  の閃光で照射すると、ドープング効率は 50% であり、十分実用に供しうるものが得られる。

(4) ホウ素を加速エネルギー 50 keV で、 $5 \times 10^{15}$  個/cm<sup>2</sup> 打ち込んじ、反射率  $\bar{R}$  が 0.41 のウエハーを 600°C に予備加熱しておき、このウエハーを  $t = 400$ 、 $E = 30$  の閃光で照射すると、ウエハーの表面が溶融して 0.1~0.3  $\mu$ m の凹凸が生じ、表面クラックも発生する(アニール不良)。

(5) ヒジを加速エネルギー 100 keV で  $2 \times 10^{15}$  個/cm<sup>2</sup> 打ち込んじ、反射率  $\bar{R}$  が 0.39 のウエハーを、予備加熱 400°C とし、 $t = 150$ 、 $E = 13.5$  の閃光で照射すると、ドープング効率は 42% と低い(アニール不良)。

(6) リンを加速エネルギー 50 keV で  $5 \times 10^{15}$  個/cm<sup>2</sup> 打ち込んじ、反射率  $\bar{R}$  が 0.46 のウエハーを、予備加熱 340°C とし、 $t = 780$ 、 $E = 32.5$  の閃光で照射すると、ドープング効率が 100% 以上達し

ウエハーの「ソリ」もよく、良好なアニールが得られる。

(7) 上記(6)と同じウエハーを、予備加熱 300°C とし、 $t = 780$ 、 $E = 29$  の閃光で照射すると、ドープング効率が 70% で「ソリ」もよく、良好なアニールとなる。

(8) リンを加速エネルギー 50 keV で、 $5 \times 10^{15}$  個/cm<sup>2</sup> 打ち込んじ、反射率  $\bar{R}$  が 0.5 のウエハーを予備加熱 500°C とし、 $t = 1000$ 、 $E = 33$  の閃光で照射した場合、ウエハーが変形し、後工程で不良と目、をしよう。

(9) ヒジを加速エネルギー 100 keV で、 $1 \times 10^{17}$  個/cm<sup>2</sup> 打ち込んじ、反射率  $\bar{R}$  が 0.39 のウエハーを、あらかじめ 500°C に予備加熱しておき、 $t = 150$ 、 $E = 18$  の閃光で照射すると、ドープング効率が 90% とはり、非常に良いアニールができる。

ホウ素を加速エネルギー 50 keV で  $5 \times 10^{15}$  個/cm<sup>2</sup> 打ち込んじ、反射率  $\bar{R}$  が 0.5 のウエハーを、予備加熱 500°C とし、 $t = 400$ 、 $E = 27$  の閃光で照射すると、ドープング効率は 75% とはり

(アニール良好)。

以上の代表的例及び他の多くの実験から、直線  $X_2$  を越える区域では、大抵において、凹凸、クラック、「ソリ」、やがみ等の不良がみられ、直線  $X_1$  に満たない区域では、ドープング効率が 45% に満たず、 $t$  が 70~780 の範囲で、 $X_1$  と  $X_2$  との間で表せば、ドープング効率が 45% 以上でかつ、物理的の変形もなく、良好なアニールが達成される。

本発明は以上の説明からも理解されるように、イオン打ち込み後の半導体シリコンのアニールをするにあつて閃光放電灯からの閃光照射を利用するものであるが、サマールアシスト法を併用し、予備加熱温度、ウエハーの反射率、閃光のパルス巾、照射エネルギー等とを適しにうえて、ドープング効率が 45% 以上でしかも良好なアニールが達成される新規なアニール方法を提供するものであり、パルス巾(半波高長)  $t$  (マイクログラ秒) が 70~780 において、

$$2.3 \times 10^{-3} t^{0.27} \leq \frac{(1-\bar{R}) \cdot E}{1410 - T_A} \leq 3.8 \times 10^{-3} t^{0.28}$$

なる条件を維持することによるものである。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明に使用する間光放電灯の一例の説明図、第2図は、本発明に使用するアニール炉の一例の各部の概略の説明図、第3図は、第1図の説明図であって、1は、1対の電極、2は封筒にルブ、3は間光放電灯、4は反射ミラー、5は試料台、6はウェハーと夫々示す。

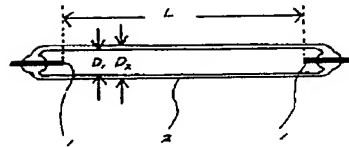
特許出願人

ウシオ電機株式会社

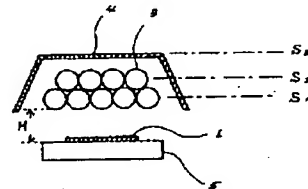


図面の浄書(内容に変更なし)

第 1 図



第 2 図



手 続 補 正 書 (自発)

昭和56年5月22日

特許庁長官 島田春樹 殿

〒特許庁審判官 殿

#### 1. 事件の表示

昭和 56 年 特 許 願第46256号

#### 2. 発明の名称

シリコン半導体のアニール方法

#### 3. 補正をする者

事件との関係 特 許 出 願 人

住所 〒100 東京都千代田区大手町2丁目6番1号

朝日東海ビル19階

名称 ウシオ電機株式会社

代表者 代表取締役 澤本大蔵

#### 4. 補正により増加する発明の数

なし

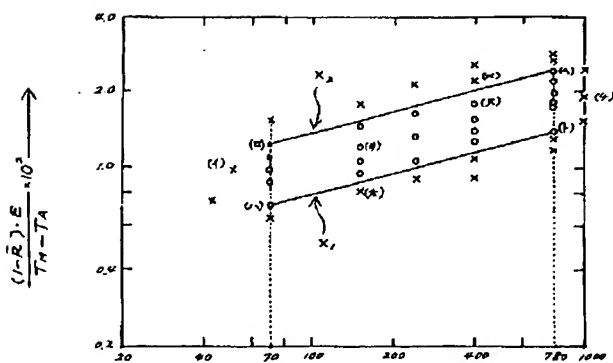
#### 5. 補正の対象

(1) 明 細 書

(2) 図 面

#### 6. 補正の内容

- (1) 別紙の通り訂正します。
- (2) 別紙の通り浄書した図面を提出します。



第 3 図



## (訂正) 明 細 書

## 1. 発明の名称

シリコン半導体のアニール方法

## 2. 特許請求の範囲

あらかじめ温度 $T_A$  (℃) に予備加熱されたシリコン半導体を、閃光放電灯からの閃光照射でアニールするにあたって、シリコン半導体の反射率を $\tilde{R}$ 、閃光のパルス巾 ( $\frac{1}{2}$ 波高長) を $t$  (マイクロ秒)、シリコン半導体上における照射強度を $E$  (ジュール/cm<sup>2</sup>) とした時、 $t$  が、 $70 \leq t \leq 780$  の範囲であって、

$$2.3 \times 10^{-3} t^{0.27} \leq \frac{(1-\tilde{R})E}{1410-T_A} \leq 3.8 \times 10^{-3} t^{0.28}$$

なる関係が維持される条件でアニールすることを特徴とするシリコン半導体のアニール方法。

## 3. 発明の詳細な説明

本発明は、シリコン半導体のアニール方法に関する。

シリコン半導体を基板として、種々の IC、LSI 等を製作する場合、不純物イオンとしてリン (P)、ホウ素 (B)、ヒ素 (As) 等を高エネ

上記理由から、アニールための昇温エネルギーを全部閃光放電灯からの閃光照射によることを避け、あらかじめある温度まで予備加熱しておいて比較的閃光照射の強度が小さくて済むような予備加熱方式 (サーマルアシスト法) を併用し、更に、シリコン半導体の反射率も考慮したうえで閃光照射の強度を定めた方がよい。

ところで、反射率 $\tilde{R}$ を有するシリコン半導体に、パルス巾 ( $\frac{1}{2}$ 波高長)  $t$  (マイクロ秒) の閃光でシリコン半導体上における照射強度 $E$  (ジュール/cm<sup>2</sup>) を与えると、シリコン半導体の表面の上昇温度は、パルス巾がおおよそ50マイクロ秒以上では、近似的に次式で与えられる。

$$T_s (^\circ\text{C}) = \alpha \cdot (1-\tilde{R}) \cdot E \cdot t^b \quad (1)$$

式(1)において、 $\alpha$ はその物質の特定の温度における、熱伝導率、密度、比熱等で定まる定数、 $(1-\tilde{R}) \cdot E$ は、その物質に吸収された単位面積当りのエネルギーである。したがって、アニール温度の上限値を $T_M$ 、予備加熱された温度を $T_A$ とすると、閃光照射によって昇温してやればよい温度差

ルギーでイオン打ち込みすることが行なわれる。

この場合、良く知られているように、シリコン半導体に結晶損傷が生ずるので、このイオン打ち込み工程後、必ず結晶損傷回復のためのアニール工程を必要とする。

従来、このアニール工程では、電気炉法とレーザービーム法とが知られているが、いずれも実用上問題が多く、ごく最近では、閃光放電灯による閃光照射を利用することが検討されている。

閃光放電灯は周知の如く、一般には、ガラス製特殊なもので透光性セラミック製の封体バルブを有し、閃光照射の強度を大きくすると閃光放電灯の使用寿命が著しく短くなる欠点があるとともに、シリコン半導体の表面は平滑性を高くするために鏡面加工されているので、したがって、反射率が高いのでシリコン半導体上における照射強度を定めるだけでは、必ずしも良好なアニールは実行できない。例えば、ドーピング効率45%以上のアニールを閃光放電灯の照射のみで実行しようとするとは実際にはかなりの困難をとまらう。

は、

$$T_M - T_A = \alpha \cdot (1-\tilde{R}) \cdot E \cdot t^b \quad (2)$$

の式で与えて良い。そして更に、式(2)を変形して $\alpha$ を $\alpha'$ 、 $b$ を $b'$ と置き替えると、

$$(1-\tilde{R}) \cdot E = (T_M - T_A) \cdot \alpha' \cdot t^{b'} \quad (3)$$

もしくは

$$\frac{(1-\tilde{R}) \cdot E}{T_M - T_A} = \alpha' \cdot t^{b'} \quad (4)$$

として良い。

本発明は係る観点から、予備加熱温度、反射率、パルス巾、照射エネルギー等の要因を考慮したりえてドーピング効率が45%以上で、良好なシリコン半導体のアニール方法を提供することを目的としてなされたものであって、その特徴とするところは、あらかじめ温度 $T_A$  (℃) に予備加熱されたシリコン半導体を閃光放電灯からの閃光照射でアニールするにあたって、シリコン半導体の反射率を $\tilde{R}$ 、閃光のパルス巾 ( $\frac{1}{2}$ 波高長) を $t$  (マイクロ秒)、シリコン半導体上における照射強度を $E$  (ジュール/cm<sup>2</sup>) とした時、 $t$  が $70 \leq t \leq 780$  の範囲であって

$$2.3 \times 10^{-3} \epsilon^{0.27} \leq \frac{(1-\tilde{R}) \cdot E}{1410 - T_A} \leq 3.8 \times 10^{-3} \epsilon^{0.28}$$

なる関係が維持される条件でアニールすることにある。

以下図面を参照しながら本発明の実施例を説明する。

第1図は本発明に使用する閃光放電灯の説明図であって、1は一对の電極、2は封体バルブであって、アーク長 $l$ は40mm、バルブ内径 $D_1$ は8mm、外径 $D_2$ は10mmの寸法を有する直管状のものを示す。この閃光放電灯3を、第2図に示すように、平面 $S_1$ 内に5本、平面 $S_2$ 内に4本、合計9本がチドリ状に密接して配設され、この9本の閃光放電灯群によって、約50mm×40mmの閃光面光源が形成されるように配置する。そして、平面ミラー4を、平面 $S_2$ に近接した平面 $S_3$ 内に配置し、ヒーター等で予備加熱できるようにした試料台5を、光源から約10mm(=H)離間して配置して、全体をアニール炉として構成する。

第2図のアニール炉において、シリコン半導体のウエハー6は、試料台上に配置されることにな

るが、ウエハー上における照射強度 $E$ (ジュール/cm<sup>2</sup>)及びパルス巾 $\epsilon$ (マイクロ秒)は、閃光放電灯に係給される電気入力及び電気回路条件を変えることによって、また予備加熱温度 $T_A$ (℃)はヒーターの温度を変えることによって、種々の値を選択でき、アニール実験に供したウエハーは、結晶損傷の深さが大体0.2 $\mu$ m~1.0 $\mu$ m、ウエハーの厚みは、300 $\mu$ m~650 $\mu$ mのものをサンプルとしている。

第3図は予備加熱温度 $T_A$ 、照射エネルギー $E$ 、パルス巾 $\epsilon$ を変えて測定した多数の実験結果を、 $Y$ 軸を $\epsilon$ 、 $X$ 軸を $\frac{(1-\tilde{R}) \cdot E}{T_M - T_A}$ として整理したものであって、 $\times$ 印はアニール不足または不良、 $\bigcirc$ 印はアニール良好を示し、 $\epsilon$ が70~780の範囲内で、直線 $X_1$ と $X_2$ との間の区域が、良好なアニールが出来ることを示している。そして、このデータの数値にもっともよく適合するように式(5)の定数 $T_M$ および $\alpha'$ 、 $\beta'$ を求め、 $T_M=1410$ (℃)、 $X_1$ における $\alpha'=2.3 \times 10^{-3}$ 、 $\beta'=0.27$ 、 $X_2$ における $\alpha'=3.8 \times 10^{-3}$ 、 $\beta'=0.28$ を決定した。又、反射率 $\tilde{R}$ は、次

式(5)で定義している。

$$\tilde{R} = \frac{\int R(\lambda) \cdot I(\lambda) d\lambda}{\int I(\lambda) d\lambda} \dots\dots\dots (5)$$

ここにおいて、 $\lambda$ は波長、 $R(\lambda)$ は $\lambda$ における反射率、 $I(\lambda)$ は $\lambda$ における閃光の強度である。

以下、個々のアニール実験の代表的例を説明する。

(イ) ~~リン~~リンを加速エネルギー50KeVで、 $5 \times 10^{15}$ 個/cm<sup>2</sup>打ち込んだ、反射率 $\tilde{R}$ が0.45のウエハーを550℃に予備加熱しておき、このウエハーを、 $\epsilon=50$ 、 $E=15.6$ の閃光で照射した場合、ドーピング効率が40%となり、アニール不足が生ずる。同様に、 $\epsilon$ が50以下、その他予備加熱の温度、与える $E$ を変えた実験でもドーピング効率が更に下がり、アニール不足が見られる。

(ロ) リンを加速エネルギー50KeVで、 $2 \times 10^{15}$ 個/cm<sup>2</sup>打ち込んだ、反射率 $\tilde{R}$ が0.46のウエハーを550℃に予備加熱しておき、このウエハーを、 $\epsilon=70$ 、 $E=20.0$ の閃光で照射した場合、ドーピング効率は90%である(アニール良好)。

付上記例と同じウエハーを、予備加熱500℃、 $\epsilon=70$ 、 $E=12.2$ の閃光で照射すると、ドーピング効率は50%であり、十分実用に供しうるものが得られる。

(ハ) ホウ素を加速エネルギー50KeVで、 $5 \times 10^{15}$ 個/cm<sup>2</sup>打ち込んだ、反射率 $\tilde{R}$ が0.41のウエハーを、 $\epsilon=400$ 、 $E=30$ の閃光で照射すると、ウエハーの表面が熔融して0.1~0.3 $\mu$ mの凹凸が生じ、表面クラックも発生する(アニール不良)。

(ニ) ビンを加速エネルギー100KeVで $2 \times 10^{15}$ 個/cm<sup>2</sup>打ち込んだ、反射率 $\tilde{R}$ が0.39のウエハーを、予備加熱400℃として、 $\epsilon=150$ 、 $E=13.5$ の閃光で照射すると、ドーピング効率は42%と低い(アニール不足)。

(ホ) リンを加速エネルギー50KeVで $5 \times 10^{15}$ 個/cm<sup>2</sup>打ち込んだ、反射率 $\tilde{R}$ が0.46のウエハーを、予備加熱540℃とし、 $\epsilon=780$ 、 $E=39.5$ の閃光で照射すると、ドーピング効率が100%にも達し、ウエハーの「ソリ」もなく、

- ・ 良好なアニールが得られる。
- ・ (b) 上記(a)と同じウェハーを、予備加熱300℃とし、 $\lambda = 780$ 、 $E = 29$ の閃光で照射すると、ドーピング効率 $\approx 90\%$ で「ソリ」もなく、~~非常に~~  
~~十分実用に耐える。~~
- ・ (c) リンを加速エネルギー50KeVで、 $5 \times 10^{15}$ 個/cm<sup>2</sup>打ち込んだ、反射率 $\tilde{R}$ が0.36のウェハーを予備加熱500℃とし、 $\lambda = 1,000$ 、 $E = 33$ の閃光で照射した場合、ウェハーが変形し、後工程で不良となってしまう。そこで、 $\lambda = 1,000$ においては、他の実験でもウェハーの変形がとまらぬ点がある。
- ・ (d) ヒンを加速エネルギー100KeVで、 $1 \times 10^{15}$ 個/cm<sup>2</sup>打ち込んだ、反射率 $\tilde{R}$ が0.39のウェハーを、あらかじめ500℃に予備加熱しておき、 $\lambda = 150$ 、 $E = 18$ の閃光で照射すると、ドーピング効率が90%となり、非常に良いアニールができる。
- ・ (e) ホウ素を加速エネルギー50KeVで $5 \times 10^{15}$ 個/cm<sup>2</sup>打ち込んだ、反射率 $\tilde{R}$ が0.36のウェハーを予備加熱500℃とし、 $\lambda = 400$ 、 $E = 27$ の閃光で照射すると、ドーピング効率は $\approx 95\%$ となる。

なる条件を維持することにより得られるものである。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明に使用する閃光放電灯の一例の説明図、第2図は、本発明に使用するアニール炉の一例の要部の概略の説明図、第3図は、データの説明図であって、1は、1対の電極、2は封体バルブ、3は閃光放電灯、4は反射ミラー、5は試料台、6はウェハーを夫々示す。

特許出願人

ウソオ電機株式会社



る(アニール良好)。

以上の代表的例及び他の多くの実験から、直線 $X_2$ を越える区域では、大体において、凹凸、クラック、「ソリ」、ゆがみ等の不良がみられ、直線 $X_1$ に満たない区域では、ドーピング効率で45%に満たず、 $\lambda$ が70~780の範囲で、 $X_1$ と $X_2$ との間の区域であれば、ドーピング効率も45%以上でかつ、物理的な変形もなく、良好なアニールが達成される。

本発明は以上の説明からも理解されるように、イオン打ち込み後の半導体シリコンのアニールをするにあたって閃光放電灯からの閃光照射を利用するものであるが、サマールアシスト法を併用し、予備加熱温度、ウェハーの反射率、閃光のパルス巾、照射エネルギー等を考慮したうえで、ドーピング効率が45%以上でしかも良好なアニールが達成される新規なアニール方法を提供するものであり、パルス巾( $\frac{1}{2}$ 波高長) $t$ (マイクロ秒)が70~780において、

$$2.3 \times 10^{-3} t^{0.27} \leq \frac{(1-\tilde{R}) \cdot E}{1410 - T_A} \leq 3.8 \times 10^{-3} t^{0.28}$$

(自発)手続補正書

昭和56年6月5日

特許庁長官 島田春樹殿

#### 1. 事件の表示

昭和56年特許願第46256号

#### 2. 発明の名称

シリコン半導体のアニール方法

#### 3. 補正をする者

事件との関係

特許出願人

〒100

住所 東京都千代田区大手町2丁目6番1号

朝日東海ビル19階

名称 ウソオ電機株式会社

代表者 湯本大



#### 4. 補正によって増加する発明の数

なし

#### 5. 補正の対象

(1) 明細書

#### 6. 補正の内容

(1) 昭和56年5月20日提出の(訂正)明細書の第8頁第15行「を、」とあるのを、「一



特開昭57-162340(8)

を600℃に予備加熱しておき、このユニバー  
を、Jと訂正する。